PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-228019

(43) Date of publication of application: 15.08.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/09

G11B 7/12

(21)Application number: 11-029659

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

08.02.1999

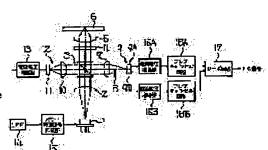
(72)Inventor: HIRAI HIDEAKI

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform a highly precise servo control or a highly precise signal detection by providing a control circuit eliminating the offset accompanied by a flare component from the output signal of a current and voltage amplifier between the current and voltage amplifier and a servo circuit of every current and voltage amplifier to prevent the offset from being generated in a focus error signal, a tracking error signal and a reproduced signal.

SOLUTION: Flare canceling circuits 18A, 18B as a first control part are provided between current and voltage amplifier circuits 16A, 16B provided in photodetectors 9A, 9B of a light receiving element 9 and a servo circuit 17 generating a focus error signal FE. The flare canceling circuits 18A, 18B cancel flare components by applying proper offset voltages to output signals from the circuits 16A, 16B. Thus, a fear that an offset due to the flare component is generated in the focus error signal FE which is to be generated by the servo circuit 17 is eliminated and the highly precise focusing servo control is made possible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-228019 (P2000-228019A)

(43)公開日 平成12年8月15日(2000.8.15)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/09 7/12 G11B 7/09 7/12 A 5D118 5D119

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平11-29659

(22)出願日

平成11年2月8日(1999.2.8)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 平井 秀明

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 100101177

弁理士 柏木 慎史 (外1名)

Fターム(参考) 5D118 AA18 BA01 CA01 CC06 CD02

CD03 CD11

5D119 AA20 AA29 BA01 DA05 EA02

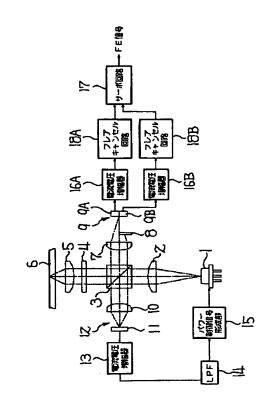
EA03

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

(57) 【要約】

【課題】 サーボ信号に、フレアなどに起因したオフセ ットが発生せず、精度のよいサーボ制御を行なえる光ピ ックアップ装置を提供する。

【解決手段】 各々の受光部9A, 9Bからの検出信号 中に含まれるフレア成分を各々のフレアキャンセル回路 18A, 18Bにより除去した信号を用いてサーボ回路 17でサーボ信号の生成を行なうことで、サーボ信号に フレア成分に起因するオフセットが発生するおそれがな く、精度のよいサーボ制御が可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光源と、このレーザ光源からの出射光に基づく光記憶媒体からの反射光を検出する複数の受光部と、これらの受光部より出力される検出信号を電圧信号に変換し増幅して出力する複数の電流電圧増幅器と、これらの電流電圧増幅器からの出力信号に基づき所定の演算処理によりサーボ信号を生成するサーボ回路とを備えた光ピックアップ装置において、

前記電流電圧増幅器と前記サーボ回路との間に前記電流 電圧増幅器からの出力信号からフレア成分に伴うオフセットを除去する第1の制御回路を前記電流電圧増幅器毎 に設けたことを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項2】 フレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去する第2の制御回路を、前記サーボ回路の後段に設けたことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップ装置。

【請求項3】 前記レーザ光源からの出射光に基づきその光量を検出するレーザ光量検出手段を備え、前記第2の制御回路は、前記レーザ光量検出手段の出力値に比例したオフセット電圧を減算することによりフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去することを特徴とする請求項2記載の光ピックアップ装置。

【請求項4】 前記第2の制御回路は、前記第1の制御回路からの出力信号の和信号に比例したオフセット電圧を減算することによりフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去することを特徴とする請求項2記載の光ピックアップ装置。

【請求項5】 前記レーザ光源からの出射光に基づきその光量を検出するレーザ光量検出手段を備え、前記第1の制御回路は、前記レーザ光量検出手段の出力値に比例したオフセット電圧を減算することによりフレア成分に伴うサーボ信号のオフセットを除去することを特徴とする請求項1ないし4の何れかーに記載の光ピックアップ装置。

【請求項6】 前記制御回路は、前記光記憶媒体に応じてオフセット調整自在であることを特徴とする請求項1ないし5の何れか一に記載の光ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ピックアップ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、光ピックアップ装置においては、受光素子に信号光以外の光が入射しオフセットを発生させる現象がある。これは、光ピックアップ装置を形成する光学素子或いはハウジングなどにおいて発生する正規の屈折又は反射以外に因るもので、一般に、このような不要光は"フレア"と称されている。このフレアは、光記憶媒体からの反射光である検出信号にオフセットを生じさせる。

【0003】このフレアの対処方法としては、光学系の内部壁において光を反射或いは散乱させそうな部分に黒染処理などの無反射・光吸収処理を施して組立てるのが一般的である。しかしながら、このような処理を施しても、光学素子そのものの内部反射光をゼロにすることは不可能であり、フレアは残存する。

【0004】このようなフレアに関する対応策として、 特許掲載公報第2815366号(特開平2-9030 号公報参照) に示される光ディスクの記録及び/又は再 生装置がある。図10はその提案内容の概略構成を示す 図である。図中、101は光磁気ディスク、102は半 導体レーザ、103はコリメートレンズ、104,10 5はビームスプリッタ、106は対物レンズ、107は 光ピックアップである。半導体レーザ102はレーザ発 光駆動回路108により発光駆動されるもので、その発 光量をビームスプリッタ105、検出レンズ109及び 受光素子110により検出し、低域通過フィルタLPF 111及び制御アンプ112を介してレーザ発光駆動回 路108にフィードバックさせることにより、半導体レ ーザ102の発光パワーが一定となるように自動制御す るAPC (自動パワー制御) 系が構成されている。ま た、ビームスプリッタ104の反射光の光路上にはサー ボ用光検出部113が設けられており、その検出信号に 基づきサーボ回路114により対物レンズ106のサー ボ駆動機構115に対してサーボ制御をかけるようにし ている。116は反射光信号検出部である。

【0005】このような基本的な構成下に、APC回路系のレーザ光量検出信号に応じてサーボ回路114の信号レベルを制御することによりフレアをキャンセルするようにしたものである。具体的には、レーザ光量検出信号をゲイン調整し、極性が逆となるようにしてサーボエラー信号に合まれるフレア成分をキャンセルしている。即ち、APC回路系の発光パワー検出信号(制御アンプ112からの出力信号)をフレアキャンセル回路116に送り、このフレアキャンセル回路116に送り、このフレアキャンセル回路116に送り、コンプーボエラー信号から減算するようにしている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述の公報例のように、APCからの検出信号に基づいたオフセット調整をサーボ信号に施すフレアキャンセル方式は、半導体レーザからの出射パワーと光記憶媒体からの検出信号との関係が一定であれば有効であるが、半導体レーザからの出射パワーと光記憶媒体からの検出信号との関係が変動する場合には、フレアキャンセルが正常に行われなかったり、行えるにしても煩雑なゲイン調整が必要となる。

【0007】 この点について、以下の4つのケース $1\sim$ 4に分け、表1を参照して詳細に説明する。この内、ケース1, 2は出射パワーと検出信号との関係が一定な場

合に相当し、ケース3,4は出射パワーと検出信号との関係が一定でなく、上述の公報例では対応できない場合に相当する。

【0008】 【表1】

..... (1)

(従来例)は、

	状態①	状態②	状態③	状態④
a 領域信号成分: A	6. D	30, 0	12.0	20, 0
b 領域信号成分: B	4. D	20. 0	8. 0	13, 3
a 領域フレア成分:ΔA	3, 0	15,0	3, 0	1 5. D
b領域フレア成分: ΔB	4, D	20, 0	4, 0	20, 0
FE信号	0, 20	0, 20	0, 20	0, 20
FE信号(フレブ込み)	D. D6	0, 06	0.11	0.02
補正後FE信号(従来例)	0, 20	0, 20	0, 25	0, 17
補正後FE信号(本発明)	0, 20	0, 20	0, 20	0.20

【0009】ケース1(表1中の状態①に相当する) …再生専用の光ピックアップ装置で、再生に用いられる 光記憶媒体の反射率がほぼ同一である場合…

一般に、受光素子は複数の受光領域に分割されており、

FE = (A - B) / (A + B)

として検出される。表 1 中の状態①に示すように、信号出力 A , B が各々 6 , 4 のとき、フォーカスエラー信号 FE は FE = 0 . 2 0 となる。

【0010】しかし、実際は受光素子に信号光以外のフ

FE(フレア込み)

= $[(A + \Delta A) - (B + \Delta B)] / [(A + \Delta A) + (B + \Delta B)]$ (2)

となる。表 1 中の状態①に示すように、フレア成分 Δ A, Δ Bが各々 3, 4 のとき、フォーカスエラー信号 F E (フレア込み) は F E (フレア込み) = 0. 0 6 となり、正確なフォーカシングが不可能となる。

FE (従来例)

=FE (フレア込み) $-k[(\Delta A - \Delta B)/(\Delta A + \Delta B)]$ (3)

となる。 k は任意の係数である。(3)式によれば、表 1 中の状態のに示すように、フレア成分 Δ A, Δ B が各 α 3, 4 のとき、フォーカスエラー信号 F E(従来例) =0 . 2 0 となり、フレアが存在しない場合のフォーカスエラー信号 F E と同値となる。なお、表 1 中の状態の の場合、係数 k は 1 でよいが、そうでない場合には適当な値とすることにより、フォーカスエラー信号 F E C (従来例)をフレアが存在しない場合のフォーカスエラー信号 F E C 一致させることが可能となる。

【0012】ケース2(表1中の状態**②②**に相当する) …再生のみならず記録も可能な光ピックアップ装置で、 記録及び再生に用いられる光記憶媒体の反射率がほぼ同 ーで記録中に反射率が変化しない場合…

このケース2の例として、例えば、再生時に表1中の状態 $\mathbb Q$ であったものが、記録時には再生時の5倍の出射パワーが必要となる場合を考える。出射パワーが5倍になると、フレア成分も5倍となる。また、このケースでは反射率は常時一定であるため、光記憶媒体からの信号光の出力も出射パワーに比例して5倍となり、表1中の状態 $\mathbb Q$ のようになる。即ち、信号光成分A, BがA0, A0 で、フレア成分A0, A1 のとな

各々の受光領域からの信号出力を演算してサーボ信号を 生成する。例えば、受光素子が受光領域 a, bからな り、各々の受光領域 a, bからの信号出力をA, Bとし たとき、例えば、フォーカスエラー信号FEは、

レアが侵入しており、受光領域 a, bに入射するフレア 成分を ΔA , ΔB としたとき、フォーカスエラー信号 F E (フレア込み) は、

【0011】ここで、上述の公報に示される従来例方式

を式で表現すると、補正後のフォーカスエラー信号FE

る。この場合、フレアに対する補正を行なわなければ、フォーカスエラー信号FE(フレア込み)はFE(フレア込み)。 06 となり(本来は、0.20)、正確なフォーカシングが行なえない。そこで、(3) 式のようなフレアに対する補正を行なうと、補正後のフォーカスエラー信号FE(従来例)は、FE(従来例)=0.20 となり、フレアが存在しない場合のFEと同値となる。

【0013】ケース3(表1中の状態**②**3に相当する) …再生のみならず記録も可能な光ピックアップ装置で、 記録又は再生に用いられる光記憶媒体の反射率が異なる 場合…

このケース3の例として、例えば、或る光記憶媒体の再生時に表1中の状態①であったものが、この光記憶媒体の2倍の反射率を有する光記憶媒体を状態①と同じ出射パワーで再生を行なう場合を考える。出射パワーは状態①と同じであるため、フレアは状態①と同値である。一方、光記憶媒体の反射率が2倍になっているため、信号光成分は2倍となり、表1中の状態③のようになる。即ち、信号光成分A、Bが各々12、8で、フレア成分 Δ A、 Δ Bが3、4となる。この場合、フレアに対する補

正を行なわなければ、フォーカスエラー信号FE(フレア込み)はFE(フレア込み)=0.11となり(本来は、0.20)、正確なフォーカシングが行なえない。かといって、(3)式のようなフレアに対する補正を行なっても、補正後のフォーカスエラー信号FE(従来例)は、FE(従来例)=0.25となり、過補正状態となる。ちなみに、係数 k を反射率が異なる光記憶媒体に応じて変化させれば適正な補正は可能であるが、機構が複雑となってしまう。

【0014】ケース4(表1中の状態**①②→③**に相当する)

…再生のみならず記録も可能な光ピックアップ装置で、 記録又は再生に用いられる光記憶媒体が記録中に反射率 が変化する場合…

このケース4の例として、例えば、記録後に反射率が2/3になる光記憶媒体を、状態②と同じ出射パワーで記録を行なった場合を考える。出射パワーは状態②と同じであるため、フレアは状態②と同値である。一方、光記憶媒体の反射率が記録前に比べて2/3になっているため、信号光成分は記録前に状態②であったものが記録後は2/3となり、表1中の状態④のようになる。即ち、

信号光成分A,Bが各々記録前後で30,20から20,13.3となり、フレア成分 Δ A, Δ Bが15,20となる。この場合、フレアに対する補正を行なわなければ、フォーカスエラー信号FE(フレア込み)はFE(フレア込み)=0.02となり(本来は、0.20)、正確なフォーカシングが行なえない。かといって、(3)式のようなフレアに対する補正を行なっても、補正後のフォーカスエラー信号FE(従来例)は、FE(従来例)=0.17となり、やはり、補正しきれない状態となる。

【0015】このように、半導体レーザの出射パワーと 光記憶媒体からの検出信号との関係が変動する場合に は、上述の公報による従来例では対応しきれない。

【0016】さらに、サーボ信号にオフセットを生じさせる原因としては、光ピックアップ装置の組付誤差など、フレア成分以外の要因によるものもある。このフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットの大きさも、光記憶媒体の反射率などによって変化するものである。フレア成分以外の要因に伴うフォーカスエラー信号のオフセットを Δ FE(フレア以外)と表現するものとすると、(2)式は、

FE = {(A+ ΔA) - (B+ ΔB)} / {(A+ ΔA) + (B+ ΔB)} - ΔFE (フレア以外)(4)

となる。(4)式は(2)式に比べ、より実際的な式といえる。そのため、フォーカスエラー信号は、フレア成分 ΔA , ΔB 及びフレア成分以外の要因に伴う成分 ΔF E(フレア以外)の両方を除去した信号として生成されるべきである。

【0017】そこで、本発明は、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号或いは再生信号に、フレア或いは組付誤差などに起因したオフセットが発生せず、精度のよいサーボ制御或いは信号検出を行なえる光ピックアップ装置を提供することを目的とする。

[0018]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、レーザ光源と、このレーザ光源からの出射光に基づく光記憶媒体からの反射光を検出する複数の受光部と、これらの受光部より出力される検出信号を電圧信号に変換し増幅して出力する複数の電流電圧増幅器と、これらの電流電圧増幅器からの出力信号に基づき所定の演算処理によりサーボ信号を生成するサーボ回路とを備えた光ピックアップ装置において、前記電流電圧増幅器と前記サーボ回路との間に前記電流電圧増幅器からの出力信号からフレア成分に伴うオフセットを除去する第1の制御回路を前記電流電圧増幅器毎に設けた。

【0019】従って、各々の受光部からの検出信号中に 含まれるフレア成分を各々の第1の制御回路により除去 した信号を用いてサーボ回路でサーボ信号の生成を行な うので、サーボ信号にフレア成分に起因するオフセット が発生するおそれがなく、精度のよいサーボ制御が可能 となる。

【0020】請求項2記載の発明は、請求項1記載の光 ピックアップ装置において、フレア成分以外の要因に伴 うサーボ信号のオフセットを除去する第2の制御回路 を、前記サーボ回路の後段に設けた。

【0021】従って、第2の制御回路により、組付誤差などのフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去するので、サーボ信号にフレア成分以外の要因に伴うオフセットが発生するおそれがなく、精度のよいサーボ制御が可能となる。

【0022】請求項3記載の発明は、請求項2記載の光ピックアップ装置において、前記レーザ光源からの出射光に基づきその光量を検出するレーザ光量検出手段を備え、前記第2の制御回路は、前記レーザ光量検出手段の出力値に比例したオフセット電圧を減算することによりフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去する。

【0023】従って、反射率一定の光記憶媒体に限らず、反射率の異なる光記憶媒体や記録中に反射率が変化する光記憶媒体の場合であっても、オフセットを動的に除去することができる。

【0024】請求項4記載の発明は、請求項2記載の光 ピックアップ装置において、前記第2の制御回路は、前 記第1の制御回路からの出力信号の和信号に比例したオフセット電圧を減算することによりフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去する。

【0025】従って、反射率一定の光記憶媒体に限らず、反射率の異なる光記憶媒体や記録中に反射率が変化する光記憶媒体の場合であっても、オフセットを動的に除去することができる。

【0026】請求項5記載の発明は、請求項1ないし4の何れか一に記載の光ピックアップ装置において、前記レーザ光源からの出射光に基づきその光量を検出するレーザ光量検出手段を備え、前記第1の制御回路は、前記レーザ光量検出手段の出力値に比例したオフセット電圧を減算することによりフレア成分に伴うサーボ信号のオフセットを除去する。

【0027】従って、第1の制御回路に対してレーザ光 量検出手段の出力値に比例したオフセット電圧を印加す ることで、受光部からの検出信号中に含まれるフレア成 分に起因するオフセットを除去し、光記憶媒体からの信 号成分のみを抽出するため、サーボ信号にフレア成分に 起因するオフセットが発生するおそれがなく、精度のよ いサーボ制御が可能となる。

【0028】請求項6記載の発明は、請求項1ないし5の何れか一に記載の光ピックアップ装置において、前記制御回路は、前記光記憶媒体に応じてオフセット調整自在である。

【0029】従って、第1或いは第2の制御回路は、記録或いは再生を行なう光記憶媒体に応じてオフセット調整自在なため、反射率一定の光記憶媒体に限らず、反射率の異なる光記憶媒体に関しても、フレア成分或いはフレア成分以外の要因によるオフセットを除去することができる。

[0030]

【発明の実施の形態】本発明の第一の実施の形態を図1及び図2に基づいて説明する。まず、光ピックアップ装置の概略構成を図1を参照して説明する。レーザ光源である半導体レーザ1からの出射光は、コリメートレンズ2により略平行光とされ、偏光ピームスプリッタ3を透

R f = a + b + c + d

となる。このR f 信号を、光記憶媒体 6 の面振れやトラック振れに影響されることなく検出できるようにフォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー信号TEを検出する必要がある。

【0033】図1では、フォーカスエラー信号FEの検

 $FE = \{(a+b) - (c+d)\} / (a+b+c+d)$ (6)

となる。

【0034】一方、トラッキングエラー信号TEの検出 方法としては、例えば、プッシュプル法がある。プッシュプル法は、米記憶媒体6上の案内溝で反射回折された

 $TE = \{(a+c) - (b+d)\} / (a+b+c+d)$ (7)

ュプル法は、光記憶媒体 6 上の案内溝で反射回折された TF= | (a + c) - (b + d) | / 過し、1/4波長板4を透過することで直線偏光から円 偏光に変換される。この後、対物レンズ5で光記憶媒体 6上に微小スポットとして集光され、情報の記録或いは 再生に用いられる。光記憶媒体6からの反射光は、対物 レンズ5で再び略平行光とされ、1/4波長板4に入射 し、半導体レーザ1からの往路光とは直交する偏光方向 の直線偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ3により 反射される。偏光ビームスプリッタ3により反射された 光は検出レンズ7により収束光とされ、フォーカスエラ ー信号生成用のナイフエッジ8により光束の一部がカッ トされた状態で、情報信号、サーボ信号検出用の受光素

【0031】一方、半導体レーザ1から出射され、コリメートレンズ2を通過し偏光ビームスプリッタ3に入射した光の一部がレンズ10を介してAPC用の受光素子11に入射する。これらのレンズ10、受光素子11等によりレーザ光量検出手段12が構成されている。ここに、APCとは、半導体レーザ1の発光パワーを自動制御するためのものであり、受光素子11からの検出信号は電流電圧増幅器13で電流から電圧信号に変換され増幅された後、数kHz~数十kHzの信号を通過させる低域通過フィルタ(LPF)14を介してパワー制御信号形成部15に送出され、ゲイン調整やオフセット調整が行なわれ、半導体レーザ1に対する駆動回路(図示せず)に出力される。

【0032】ここで、受光素子9とサーボ信号について説明する。一般に、受光素子は複数の受光領域に分割されており、各々の受光領域からの信号出力を演算処理することによりサーボ信号が生成される。例えば、4つの受光領域に分割された受光素子9において、サーボ信号、情報信号を生成する方法について以下に説明する。受光素子9を構成する各受光領域 a, b, c, dから後述する電流電圧増幅器16A,16Bを介して出力される各信号成分 a, b, c, dの合計が光記憶媒体6からの情報信号(いわゆるRf信号)となる。即ち、Rf信号は

..... (5)

子9に入射する。

出方法としてナイフエッジ法を採用している。ナイフエッジ法は、光記憶媒体6から戻ってきた収束光路中にナイフエッジを配置して、受光素子9上での点光像の移動 距離を検出することによりフォーカスエラー信号を検出するものであり、

光をトラック中心に対して対称に配置された2つの受光 領域での出力差として取り出すことによって検出する方

式であり、

[0035]以下の説明では、フォーカスエラー信号F

となる。

Eの場合を例に採り、説明する。なお、ここでは、受光領域 a, bを合せて受光部 9 A、受光領域 c, dを合せて受光部 9 Bとし、これらの複数の受光部 9 A, 9 Bか

FE = (A - B) / (A + B)

として表すことができる。

【0036】次に、オフセットについて説明する。上述したように、受光素子9には、実際には、信号光以外のフレアが侵入している。受光部9A、9Bに入射するフ

FE(フレア込み)

= $\{(A + \Delta A) - (B + \Delta B)\} / \{(A + \Delta A) + (B + \Delta B)\} \dots (9)$

となる。さらに、組付誤差等のフレア成分以外の要因に よってもオフセット ΔFE (フレア以外) が発生するた め、結果的に、フォーカスエラー信号は、

FE = |(A+ΔA) - (B+ΔB)| / |(A+ΔA) + (B+ΔB)| - ΔFE (フレア以外)

となり、正確なフォーカシングが不可能となる。

【0037】そこで、本実施の形態では、まず、フレア成分を除去する構成例を示すものである。受光部9A、9B毎に設けられた電流電圧増幅器16A、16Bの出力側には、これらの出力電圧に基づく所定の演算処理によりサーボ信号としてフォーカスエラー信号FEを生成するサーボ回路17が設けられるが、本実施の形態では各電流電圧増幅器16A、16Bの出力側に第1の制御回路としてのフレアキャンセル回路18A、18Bが設けられている。これらのフレアキャンセル回路18A、18Bは、各電流電圧増幅器16A、16Bからの出力信号に対して適当なオフセット電圧を印加することでフレア成分をキャンセルさせるものである。

【0038】これらのフレアキャンセル回路18A、18Bは例えば図2に示すようなオフセット補正回路として構成される。即ち、+V, -V間の抵抗の分圧値によってオフセットレベルの基準電圧を設定する可変抵抗19と、抵抗R2を介して接続されたバッファアンプ20に抵抗R3、R4を介して接続されてバッファアンプ20の出力電圧の極性を介して接続されてバッファアンプ20の出力電圧の極性を介して表力を減算器21と、抵抗R1を介して入力さる信号Aからこの演算器21の出力を減算して信号Dとで出力する差動アンプ22とにより構成されている。可要抵抗19の分圧値をコントロールすることができる。こでは、信号Aが電流電圧増幅器16A又は16Bからでは、信号Aが電流電圧増幅器16A又は16Bからでは、信号Dがフレア成分が除去されてサーボ回路17に出力される信号に相当する。

【0039】従って、本実施の形態によれば、各々の受光部9A、9Bからの検出信号中に含まれるフレア成分を各々のフレアキャンセル回路18A、18Bにより除去した信号でサーボ回路17でフォーカスエラー信号FEの生成を行なうので、フォーカスエラー信号FEにフレア成分に起因するオフセットが発生するおそれがな

ら出力される信号成分をA, Bとして表すものとする。 すると、(6)式は、

レア成分を ΔA , ΔB としたとき、このフレア成分 Δ

A, ΔBを除去しないままフォーカスエラー信号FEを

..... (8)

生成すると、

..... (10)

く、精度のよいフォーカスサーボ制御が可能となる。

【0040】本発明の第二の実施の形態を図3に基づいて説明する。第一の実施の形態で示した部分と同一部分は同一符号を用いて示し、説明も省略する(以降の各実施の形態でも同様とする)。本実施の形態では、サーボ回路17の出力側に第2の制御回路としてオフセットキャンセル回路23が付加されている。このオフセットキャンセル回路23はフォーカスエラー信号FEに付加されている組付誤差などのフレア成分以外の要因に伴うオフセット成分を除去するためのもので、フレアキャンセル回路18A、18Bの場合と同様に図2に示した構成のオフセット補正回路を利用することができる。即ち、本実施の形態の場合であれば、信号Aがフレア成分以外の要因に伴うオフセット成分を含むフォーカスエラー信号に相当する。

【0041】従って、本実施の形態によれば、オフセットキャンセル回路23により、組付誤差などのフレア成分以外の要因に伴うフォーカスエラー信号のオフセットを除去するので、フォーカスエラー信号にフレア成分以外の要因に伴うオフセットが発生するおそれがなく、精度のよいフォーカスサーボ制御が可能となる。

【0042】これらの第一又は第二の実施の形態のように、図2に示したオフセット補正回路を利用することで、記録又は再生を行なう光記憶媒体6として反射率が異なる場合でも可変抵抗19の分圧値を変更することで対応可能となる。

【0043】しかしながら、現実的には、このような分 圧値の変更をメカニカルに、その都度行なうことは機構 を煩雑化させてしまい、精度上も好ましくない。また、 前述したように半導体レーザ1の出射パワーと光記憶媒 体6からの検出信号との関係が変動する場合(例えば、 反射率が異なる場合)には、動的なオフセットキャンセ ルが必要となる。以下の実施の形態では、このような点 も考慮されている。

【0044】本発明の第三の実施の形態を図4及び図5に基づいて説明する。本実施の形態では、サーボ回路17の出力側に設けられたオフセットキャンセル回路19に対して、LPF14の出力、即ち、レーザ光量検出手段12の出力値に比例したオフセット電圧分を減算するように入力されている。即ち、APC回路系のレーザ光量検出信号に応じた適当なオフセット電圧を印加することで、フレア成分以外の要因に伴うフォーカスエラー信号におけるオフセットをキャンセルさせるものである。

【0045】本実施の形態の場合のオフセットキャンセル回路19としては、例えば、図5に示すように、信号Bを所定レベルまで上げるK倍の増幅器24と、K倍された信号Bと信号Aの引算回路25とによる回路構成で実現できる。即ち、図5において、信号BとしてAPC回路系のレーザ光量検出信号(LPF14の出力)を、信号Aとしてオフセットを伴ったフォーカスエラー信号(サーボ回路17の出力)を入力させることで、オフセットが取り除かれたフォーカスエラー信号の検出が可能となる。

【0046】従って、本実施の形態によれば、反射率一定の光記憶媒体6に限らず、反射率の異なる光記憶媒体6や記録中に反射率が変化する光記憶媒体6の場合であっても、オフセットを動的に除去することができる。

【0047】本発明の第四の実施の形態を図6に基づいて説明する。本実施の形態では、サーボ回路17の出力側に設けられたオフセットキャンセル回路19に対して、2つのフレアキャンセル回路18A,18Bの出力信号の和信号に比例したオフセット電圧分が減算するように入力されている。即ち、フレアキャンセル回路18A,18Bの出力信号の和信号に応じた適当なオフセット電圧を印加することで、フレア成分以外の要因に伴うフォーカスエラー信号におけるオフセットをキャンセルさせるものである。

【0048】本実施の形態のオフセットキャンセル回路19も、第三の実施の形態の場合と同様に、図5に示したような回路構成のオフセット補正回路を用い得る。この場合、図5において、信号Bとしてフレアキャンセル回路18A、18Bの出力信号の和信号を、信号Aとしてオフセットを伴ったフォーカスエラー信号(サーボ回路17の出力)を入力させることで、オフセットが取り除かれたフォーカスエラー信号の検出が可能となる。

【0049】従って、本実施の形態によれば、反射率一定の光記憶媒体6に限らず、反射率の異なる光記憶媒体6や記録中に反射率が変化する光記憶媒体6の場合であっても、オフセットを動的に除去することができる。

【0050】本発明の第五の実施の形態を図7に基づいて説明する。本実施の形態では、例えば、図1に示した構成において、2つのフレアキャンセル回路18A,18Bに対して、LPF14の出力、即ち、レーザ光量検

出手段12の出力値に比例したオフセット電圧分を減算するように入力されている。即ち、APC回路系のレーザ光量検出信号に応じた適当なオフセット電圧をフレアキャンセル回路18A,18Bに対して印加することで、フレア成分に伴うフォーカスエラー信号におけるオフセットをキャンセルさせるものである。

【0051】本実施の形態のフレアキャンセル回路18A,18Bは、第三、第四の実施の形態の場合と同様に、図5に示したような回路構成のオフセット補正回路を用い得る。この場合、図5において、信号BとしてAPC回路系のレーザ光量検出信号に応じた適当なオフセット電圧を、信号Aとして各々電流電圧増幅器16A,16Bからの出力信号を入力させることで、オフセットが取り除かれたフォーカスエラー信号の検出が可能となる。

【0052】図8は、本実施の形態と図4に示した第三の実施の形態とを組合せた構成例を示す。また、図9は、本実施の形態と図6に示した第四の実施の形態とを組合せた構成例を示す。何れも、フレア成分以外の要因に伴うオフセットのキャンセルも可能となるため、より正確なフォーカスエラー信号の検出が可能となり、正確なフォーカシングを行なえる。

【0053】これらの実施の形態によれば、フレア成分を含んだままフォーカスエラー信号(サーボ信号)を生成した後、フレア成分に伴うオフセットの除去を図った従来の公報例と比較すると、サーボ信号の生成前に各受光部9A、9Bからのフレア成分を除去しているので、料準体レーザ1の出射パワーの変動や光記憶媒体6のの射率の動的な変動にも対応できることとなる。即ち、がした表1中に併せて示すように、本発明によれば、ケース1~4の全てのケースについて正常にフォーカスエラー信号(補正後FE信号)を検出することができる。また、上記の従来の公報例では考慮されていない、知付誤差等で発生するフレア成分以外のオフセット成分の除去できる。即ち、(10)式で表現される無補正状態のフォーカスエラー信号に対して、本発明によれば、

(1) 式で示される本来のフォーカスエラー信号の検出が可能となる。

【0054】なお、これらの実施の形態では、サーボ信号として、フォーカスエラー信号FEを例に採り説明したが、トラッキングエラー信号TE或いは情報信号Rfについても、同様に、フレア成分或いはフレア成分以外の要因に伴うオフセットをキャンセルした状態で生成・出力させることができる。

[0055]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、各々の受 光部からの検出信号中に含まれるフレア成分を各々の第 1の制御回路により除去した信号を用いてサーボ回路で サーボ信号の生成を行なうようにしたので、サーボ信号 にフレア成分に起因するオフセットが発生するおそれが なく、精度のよいサーボ制御が可能となる。

[0056]請求項2記載の発明によれば、請求項1記載の光ピックアップ装置に加えて、第2の制御回路により、組付誤差などのフレア成分以外の要因に伴うサーボ信号のオフセットを除去するようにしたので、サーボ信号にフレア成分以外の要因に伴うオフセットが発生するおそれがなく、精度のよいサーボ制御が可能となる。

【0057】請求項3記載の発明によれば、請求項2記載の光ピックアップ装置において、反射率一定の光記憶媒体に限らず、反射率の異なる光記憶媒体や記録中に反射率が変化する光記憶媒体の場合であっても、オフセットを動的に除去することができる。

【0058】請求項4記載の発明によれば、請求項2記載の光ピックアップ装置において、反射率一定の光記憶媒体に限らず、反射率の異なる光記憶媒体や記録中に反射率が変化する光記憶媒体の場合であっても、オフセットを動的に除去することができる。

【0059】請求項5記載の発明よれば、請求項1ないし4の何れかーに記載の光ピックアップ装置において、第1の制御回路に対してレーザ光量検出手段の出力値に比例したオフセット電圧を印加することで、受光素子からの検出信号中に含まれるフレア成分に起因するオフセットを除去し、光記憶媒体からの信号成分のみを抽出するようにしたので、サーボ信号にフレア成分に起因するオフセットが発生するおそれがなく、精度のよいサーボ制御が可能となる。

【0060】請求項6記載の発明によれば、請求項1ないし5の何れか一に記載の光ピックアップ装置において、第1或いは第2の制御回路が、記録或いは再生を行

なう光記憶媒体に応じてオフセット調整自在なため、反 射率一定の光記憶媒体に限らず、反射率の異なる光記憶 媒体に関しても、フレア成分或いはフレア成分以外の要 因によるオフセットを除去することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施の形態を示す構成図であ ろ

[図2] そのフレアキャンセル回路の構成例を示す回路 図である。

【図3】本発明の第二の実施の形態を示す構成図である

【図4】本発明の第三の実施の形態を示す構成図である。

【図5】そのオフセットキャンセル回路の構成例を示す 回路図である。

【図6】本発明の第四の実施の形態を示す構成図である。

【図7】本発明の第五の実施の形態を示す構成図であ ろ

【図8】変形例を示す構成図である。

【図9】異なる変形例を示す構成図である。

【図10】従来例を示す構成図である。

【符号の説明】

9A, 9B 受光部

12 レーザ光量検出手段

16A, 16B 電流電圧増幅器

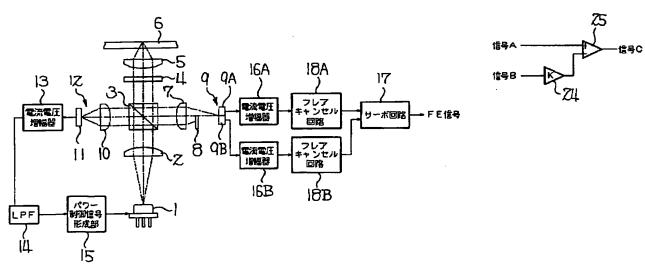
17 サーボ回路

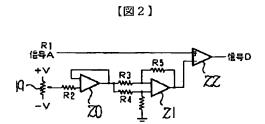
18A, 18B 第1の制御回路

23 第2の制御回路

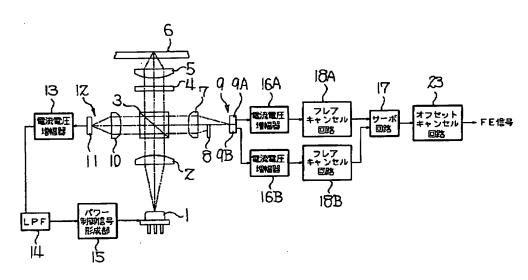
【図1】

【図5】

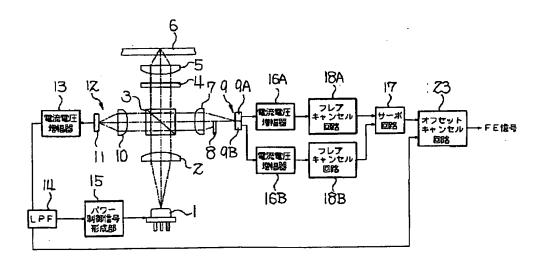




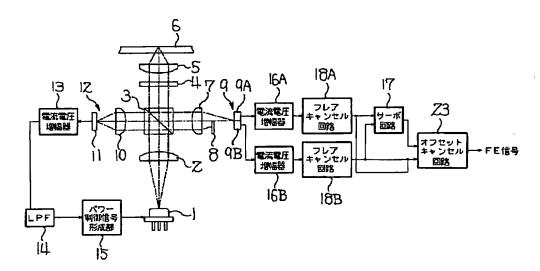
【図3】



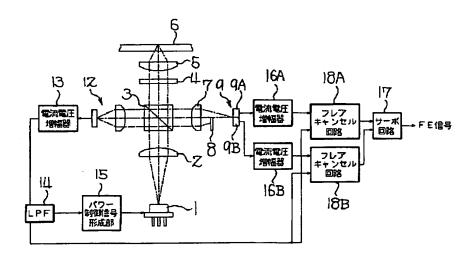
【図4】



[図6]



[図7]



【図8】

